

激光光热偏转成象法无损检测光学薄膜的激光损伤

谈恒英, 刘鹏程, 施柏煊

(浙江大学现代光学仪器国家重点实验室, 杭州 310027)

收稿日期 2003-3-4 修回日期 网络版发布日期 2006-7-24 接受日期

摘要 介绍了应用激光光热偏转成象法无损检测光学薄膜激光损伤的基本原理, 由此建立了实验检测装置, 对光学薄膜表面的激光损伤进行了扫描检测, 并以直观的灰度象显示. 实验结果证明了激光光热偏转成象法检测光学薄膜激光损伤具有直观、有效、可确定损伤阈值的优点.

关键词 [光学薄膜](#) [激光损伤](#) [光热偏转法](#)

分类号 [TN247TB303](#)

通讯作者 谈恒英 [Email:tanhy@zju.edu.cn](mailto:tanhy@zju.edu.cn)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(518KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“光学薄膜”的
相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [谈恒英](#)
- [刘鹏程](#)
- [施柏煊](#)